(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. Mai 2004 (27.05.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/044994 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation7: H01L 31/105, 31/0352, 31/0224
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003739
- (22) Internationales Anmeldedatum:

12. November 2003 (12.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 102 52 878.0 12. November 2002 (12.11.2002) DE
- (61) Zusatzanmeldung zu früherer Anmeldung früherem Patent:

DE

Nicht mitgeteilt (POA) 12. November 2003 (12.11.2003)

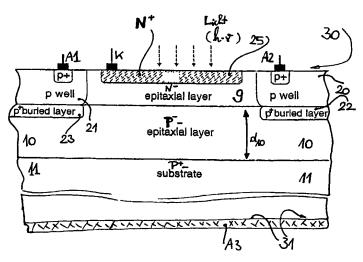
Angemeldet am

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES AG [DE/DE]; Haarbergstrasse 67, 99097 Erfurt (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EINBRODT, Wolfgang [DE/DE]; Hermann-Brill-Strasse 89, 99099 Erfurt (DE). ZIMMERMANN, Horst [DE/AT]; Poststrasse 12, A-3032 Eichgraben (AT). FOERTSCH, Michael [AT/AT]; Linzerstrasse 192/1/7, A-1140 Wien (AT).
- (74) Anwälte: LEONHARD, Reimund usw.; Leonhard Olgemoeller Fricke, Postfach 10 09 62, 80083 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW. GH. GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: MONOLITHICALLY INTEGRATED VERTICAL PIN PHOTODIODE USED IN BICMOS TECHNOLOGY
- (54) Bezeichnung: MONOLITHISCH INTEGRIERTE VERTIKALE PIN-FOTODIODE IN BICMOS-TECHNOLOGIE



(57) Abstract: The invention relates to a monolithically integrated vertical pin photodiode which is produced according to BiCMOS technology and comprises a planar surface (30) facing the light (h?) and a rear face (31), and anode connections (A1, A2) located across p areas (20, 21) on a top face of the photodiode. An i zone of the pin photodiode is formed by combining a low doped first p epitaxial layer (10, d₁₀) which has a maximum thickness of essentially 15?m and a doping concentration of less than 5*10¹⁴ cm⁻³ and is placed on a particularly high doped p substrate (10), with a low doped second n epitaxial layer (9) that borders the first layer (10) and has a doping concentration ranging substantially between 1014 cm⁻³ and 1015 cm⁻³, an n⁺ cathode (K) of the pin photodiode being integrated into said second layer (9). p areas (20, 21) delimit the second n epitaxial layer (9) in a latent direction while another anode-connecting area (A3) of the pin diode is provided on the rear face (31) in addition to the anode connections (A1, A2).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/044994 A3



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 7. April 2005
- (15) Informationen zur Berichtigung: Frühere Berichtigung: siehe PCT Gazette Nr. 30/2004 vom 22. Juli 2004, Section II

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrift eine monolithisch integrierte vertikale pin-Fotodiode, hergestellt in BiCMOS-Technologie, mit einer planaren, zum Licht (hv) gewandten Oberfläche (30) und einer Rückseite (31) und mit Anodenanschlüssen (A1, A2) über p-Gebiete (20, 21) auf einer Oberseite der Fotodiode wobei eine i-Zone der pin-Fotodiode gebildet wird durch Kombination einer niedrig dotierten, bis maximal im wesentlichen 15μm dicken ersten p·Epitaxieschicht (10,d₁₀) mit einer Dotierungskonzentration unter 5*10¹⁴ cm⁻³, die sich auf einem - insbesonderem hoch-dotierten - p-Substrat (10) befindet, mit einer an die erste Schicht (10) angrenzenden, niedrig dotierten zweiten n·Epitaxieschicht (9) mit einer Dotierung in einem Bereich von im wesentlichen 10¹⁴ cm⁻³ bis 10¹⁵ cm⁻³, in welche zweite Schicht (9) eine n⁺-Kathode (K) der pin-Fotodiode eingebracht ist und wobei in einer lateralen Richtung p-Gebiete (20, 21) die zweite n-Epitaxieschicht (9) begrenzen und zusätzlich zu den Anodenanschlüssen (A1, A2) ein weiterer Anodenanschlussbereich (A3) der pin-Diode auf der Rückseite (31) vorhanden ist.



International Application No /DE 03/03739

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L31/105 H01L31/0352 H01L31/0224

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of t	Relevant to claim No.	
A	KYOMASU M: "DEVELOPMENT OF AN HIGH SPEED SILICON PIN PHOTODI IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON IEEE INC. NEW YORK, US, vol. 42, no. 6, 1 June 1995 (1 pages 1093-1099, XP000517156 ISSN: 0018-9383 page 1093 - page 1095; figures	ODE SENSOR" DEVICES, 1995-06-01),	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 10, 31 October 1997 (1997-10-31) & JP 09 148617 A (SANYO ELECTR 6 June 1997 (1997-06-06) abstract	CIC CO LTD),	1,2, 8-12,15, 16,18,22
χ Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.
"A" documer consider E" earlier de filing de l'L" documer which is citation "O" docume other m'P" documer	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the inter- or priority date and not in conflict with- cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the ci- cannot be considered novel or carnot involve an inventive step when the doc "Y" document of particular relevance; the ci- cannot be considered to involve an inv- document is combined with one or mo ments, such combination being obviou in the art. "&" document member of the same patent f	the application but every underlying the lalmed invention be considered to cument is taken alone lalmed invention rentive step when the re other such docu- is to a person skilled
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the International sear	ch report
9	February 2005	16/02/2005	
Name and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Visentin, A	



International Application No
DE 03/03739

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	J
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	ZIMMERMANN H ED — INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS: "Monolithic bipolar—, CMOS—, and BiCMOS—receiver OEICs" 1996 INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE. SINAIA, ROMANIA, OCT. 9 — 12, 1996, INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE, NEW YORK, IEEE, US, vol. VOL. 2 CONF. 19, 9 October 1996 (1996—10—09), pages 31—40, XP010200521 ISBN: 0-7803—3223—7 the whole document	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
A	HOHENBILD M ET AL: "Advanced photodiodes and circuits for OPTO-ASICs" 2001 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO 2001 15-16 NOV. 2001, VIENNA, AUSTRIA, 15 November 2001 (2001-11-15), pages 255-260, XP010570429 the whole document	1,4,11, 12, 14-16, 20-22,24
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 447 (E-685), 24 November 1988 (1988-11-24) & JP 63 174358 A (HITACHI LTD), 18 July 1988 (1988-07-18) abstract	1,12,16, 22
A	US 4 616 247 A (CHANG ET AL) 7 October 1986 (1986-10-07) the whole document	1,5, 10-12, 15,16, 21,22
P, X	FORTSCH M ET AL: "220 MHz optical receiver with large-area integrated PIN photodiode" PROCEEDINGS OF IEEE SENSORS 2003. 2ND. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS. TORONTO, CANADA, OCT. 22 - 24, 2003, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS, NEW YORK, NY: IEEE, US, vol. VOL. 2 OF 2. CONF. 2, 22 October 2003 (2003-10-22), pages 1012-1015Vol2, XP010691061 ISBN: 0-7803-8133-5 the whole document	1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 20-22,24



International Application No

1/DE 03/03739

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages P,X FORTSCH M ET AL: "Integrated PIN photodiodes in high-performance BicMoS technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 – 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8 December 2002 (2002–12–08), pages 801–804, XP010626161 ISBN: 0-7803–7462–2 the whole document	1/DE 03/03/39
P,X FORTSCH M ET AL: "Integrated PIN photodiodes in high-performance BicMos technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8 December 2002 (2002-12-08), pages 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2	
photodiodes in high-performance BiCMOS technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8 December 2002 (2002-12-08), pages 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2	Relevant to claim No.
	Relevant to claim No. 1,2,4-6,8-12,14,16,18,20-22,24

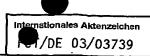


Information on patent family members

International Application No /DE 03/03739

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
JP 09148617	Α	06-06-1997	JP	3208307 B2	10-09-2001
JP 63174358	A	18-07-1988	NONE		
US 4616247	A	07-10-1986	CA EP EP JP WO	1233549 A1 0142316 A2 0163720 A1 61500396 T 8502296 A1	01-03-1988 22-05-1985 11-12-1985 06-03-1986 23-05-1985





A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L31/105 H01L31/0352 H01L31/0224

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $1PK \ 7 \ \ H01L$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

(ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	KYOMASU M: "DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED HIGH SPEED SILICON PIN PHOTODIODE SENSOR" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 42, Nr. 6, 1. Juni 1995 (1995-06-01), Seiten 1093-1099, XP000517156 ISSN: 0018-9383 Seite 1093 - Seite 1095; Abbildungen 1,2	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1997, Nr. 10, 31. Oktober 1997 (1997-10-31) & JP 09 148617 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 6. Juni 1997 (1997-06-06) Zusammenfassung	1,2, 8-12,15, 16,18,22

 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einern anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mil der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
9. Februar 2005	16/02/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter
NL 2280 HV Rijswljk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Visentin, A



Internationales Aktenzeichen
PUT/DE 03/03739

C.(Fortsetz	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Pe1/DE 03/03/39
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile Betr. Anspruch Nr.
A	ZIMMERMANN H ED - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS: "Monolithic bipolar-, CMOS-, and BiCMOS-receiver OEICs" 1996 INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE. SINAIA, ROMANIA, OCT. 9 - 12, 1996, INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE, NEW YORK, IEEE, US, Bd. VOL. 2 CONF. 19, 9. Oktober 1996 (1996-10-09), Seiten 31-40, XP010200521 ISBN: 0-7803-3223-7 das ganze Dokument	1,4,5, 7-9,11, 12, 14-17, 20-22,24
A	HOHENBILD M ET AL: "Advanced photodiodes and circuits for OPTO-ASICs" 2001 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON DEVICES FOR MICROWAVE AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. EDMO 2001 15-16 NOV. 2001, VIENNA, AUSTRIA, 15. November 2001 (2001-11-15), Seiten 255-260, XP010570429 das ganze Dokument	1,4,11, 12, 14-16, 20-22,24
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 012, Nr. 447 (E-685), 24. November 1988 (1988-11-24) & JP 63 174358 A (HITACHI LTD), 18. Juli 1988 (1988-07-18) Zusammenfassung	1,12,16, 22
A	US 4 616 247 A (CHANG ET AL) 7. Oktober 1986 (1986-10-07) das ganze Dokument	1,5, 10-12, 15,16, 21,22
Р,Х	FORTSCH M ET AL: "220 MHz optical receiver with large-area integrated PIN photodiode" PROCEEDINGS OF IEEE SENSORS 2003. 2ND. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS. TORONTO, CANADA, OCT. 22 - 24, 2003, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SENSORS, NEW YORK, NY: IEEE, US, Bd. VOL. 2 OF 2. CONF. 2, 22. Oktober 2003 (2003-10-22), Seiten 1012-1015Vol2, XP010691061 ISBN: 0-7803-8133-5 das ganze Dokument	1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 20-22,24



Internationales Aktenzeichen
DE 03/03739

Calegorie* Bezeichnung der Veröffenllichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile P, X FORTSCH M ET AL: "Integrated PIN photodiodes in high-performance BiCMOS 8-12,14, technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2002 (2002-12-08), Seiten 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2 das ganze Dokument Betr. Anspruch Nr. 1,2,4-6, 8-12,14, 16,18, 2-12,14,			PEI/DE O	3/03/39
P,X FORTSCH M ET AL: "Integrated PIN photodiodes in high-performance BiCMOS technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2002 (2002-12-08), Seiten 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2			andon Taile	To .
photodiodes in high-performance BiCMOS technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2002 (2002-12-08), Seiten 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2	ridiogonic	· Veronemilichung, soweit errordentich unter Angabe der in Betracht komm	engen lølle	Betr. Anspruch Nr.
	P,X	photodiodes in high-performance BiCMOS technology" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2002. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 8 - 11, 2002, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2002 (2002-12-08), Seiten 801-804, XP010626161 ISBN: 0-7803-7462-2		8-12,14, 16.18.
			·	
	nblatt PCT/ISA	/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichen, die zur selben Patentfamille gehören

Internationale	s Aktenzeichen
POT/DE	03/03739

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamille			Datum der Veröffentlichung	
JP 09148617	A	06-06-1997	JP	3208307	B2	10-09-2001	
JP 63174358	Α	18-07-1988	KEINE				
US 4616247	A	07-10-1986	CA EP EP JP WO	1233549 0142316 0163720 61500396 8502296	A2 A1 T	01-03-1988 22-05-1985 11-12-1985 06-03-1986 23-05-1985	